《解説》

モルデナイト細孔中の一次元カルコゲン鎖

京都大学理学部物理学第一教室

遠藤裕久,八尾 誠

1. はじめに

セレン(Se)は、2配位の鎖状構造を基本として 三方晶系の結晶を構成する(図1参照)。鎖は三回螺 旋を形成し、隣接原子間距離(共有結合長)は2.37Å, 結合角は103.1°である。Se原子の最外殻電子配置は $4s^24p^4$ で、4s電子軌道のエネルギーは4p電子軌 道に比べ低く、結合には殆ど関与しない。鎖内の共 有結合(σ 結合軌道)には4p電子のうち2個が係っ ており、残りの2個は価電子帯の最上部を占める lone pair(LP)電子軌道を形成している。一方、 伝導帯は共有結合の反結合(σ^*)軌道により形成さ れている。 Se 原子のLP軌道は隣接鎖の最近接原 子の σ^* 軌道と向い合っているため、両軌道間に混 成が起こり、隣接鎖間には比較的強い結合が生じて いる。三方晶系セレン(t-Se)結晶の安定性は、こ の比較的強い鎖間結合に係っていると思われる。



図1 三方晶セレンの結晶構造 a軸は4.37Å, c軸は4.95Åである。 太線は鎖内の共有結合を表わす。

『鎖間の相互作用を取り除いて, Se 鎖を孤立化 させた場合, Se 原子の配列や半導体特性がどのよ うに変化するのか?』 これが我々の研究の出発点 である^{1~4)}。 一本の Se 鎖を包む円柱の直径は約 6 Åであり、モルデナイト結晶の c 軸方向に延びる一



図2 c軸方向から見たモルデナイトの骨組 黒丸は珪素又はアルミニウム原子を表わす。 内壁の酸素原子の大きさも考慮すると、細孔 の有効径は約6.7 Åである。

次元細孔の有効径 6.7 Å にほぼ近い。図2に、モル デナイト結晶における SiO₄四面体・AlO₄四面体の 連結の様子を見るために、 c 軸方向からの骨組の模 式図を示した。 a 軸は 18.13 Å, b 軸は 20.49 Å であ る。

本稿では、モルデナイトが提供する空間を利用し て作製した一次元孤立カルコゲン鎖の構造及び電子 状態について、 最近の広範囲 X 線吸収端微細構造 (EXAFS)測定、光音響分光(PAS)測定の結果を 報告する。

2. 孤立カルコゲン鎖の構造解析⁵⁾

Toso 製の人工合成 Na 型モルデナイト (Na₂O・ Al₂O₃・20 SiO₂) 粉末を高真空中で 300 C の温度で 約 6 時間加熱脱水した後, 350 C で約 6 時間 Se の 蒸気と接触させることにより,モルデナイト細孔中 に Se を吸蔵した。この方法により,主細孔中に Se が閉じ込められることは,東北大学グループ⁶⁾の電 子顕微鏡観察によっても確かめられている。

結晶を構成する原子の配列を調べる最も一般的な 手段はX線回折法であるが、この方法では粉末モル デナイトの細孔中に閉じ込めた Se の構造解析には 不適当である。これは、X線回折パターンには、複 雑な単位胞を有するモルデナイトからの夥しい回折 線が現われるため、 Se からの寄与が覆い隠されて しまうからである。 Se 原子に注目し、その周囲を 調べる EXAFS 法は、我々の目的に適っている。 Se のK吸収端(12.658 keV)より高いエネルギーの X線を入射すると、 Se 原子から光電子が飛び出し、 波動として周囲に広がるが、その一部が周辺の原子 により後方散乱されて中心原子に戻ってくるため、 干渉が起こる。吸収端近傍の X線吸収曲線に振動構 造(即ちEXAFS)が現われるのは、この干渉効果に よる⁷⁰。

図3(a)に、Na型モルデナイト(M(Na)と略す) にSeを吸蔵した試料(Se-M(Na)と略す)につい ての80KにおけるEXAFS振動 $\chi(k)$ の測定結果 を示す。ここでkは光電子の波数である。実空間に おける原子配列を調べるために、 $k\chi(k)$ をフーリ



図3 SeのK吸収端近傍の80Kにおける EXAFS振動 X(k)

- (a) Se-M(Na)
- (b) $Se_{0.8}Te_{0.2}-M(Na)$
- (c) $Se_{0.63}Te_{0.37}-M(Na)$
- (d) $Se_{0.48}Te_{0.52}-M(Na)$



図4 Se-M(Na)の動径分布関数 | F(r)|

エ変換して動径分布関数 |F(r)|を求めた (図4参照)。2.0 Å付近に顕著な第一ピーク、3.3 Å付近に第 ニピークが観測される。 Se から放出される波の位 相は、中心原子や周辺原子からの影響により、変化 を受ける。 この位相シフトの効果を取り入れて、 |F(r)|の各ピークをカーブフィット法により解析 することにより、Se-M(Na)の第一、第二近接原 子間距離が、各々、2.33 Å、3.61 Å であることが判 明した。これらの値はいずれも、t-Seにおける対 応する原子間距離に比べ、明らかに短い。この結果 は、鎖間相互作用を取り除くことにより、鎖内の共 有結合が強くなることを意味している。

テルル(Te)は、Seと同族元素で、Seと同様に 三方晶系の結晶構造を有する。鎖内の最近接原子間 距離 r1と鎖間の最近接原子間距離 R1の比 R1/r1は, Seでは 1.45、Teでは 1.21 であり、Teの方が鎖間 相互作用が強いことを示している。 また、Se とTeの混合系は全濃度領域において三方晶系の固 溶体を形成し、その格子定数は濃度と共にほぼ直線 的に変化することが知られている。我々は、モルデ ナイト細孔中にSe-Te 混合系を閉じ込めることに より、種々の濃度をもつ一次元合金の作製の試みを 行った。図3(b),(c),(d)には、各々、Se_{0.8}Te_{0.2}, Seo 63 Teo 37, Seo 48 Teo 52 を M(Na)に閉じ込めた 試料の、80KにおけるSeのK吸収端のEXAFSス ペクトルを示してある。 Te 濃度の増加と共に,8 Å⁻¹付近の振動が減少し, kの小さい領域での振動 が増大する。図5にSeやTeからの後方散乱振幅 B(k)の k 依存性を示す⁸⁾。 $\chi(k)$ の結果を,後方 散乱振幅と合わせ考えると、着目する Se 原子の隣





が、Te濃度の増加に伴ない、SeからTeへ次第に 変化していることが定性的にわかる。モルデナイト 細孔内で Te と Se が二配位の混合鎖を形成するこ とを仮定して、各々の動径分布関数 |F(r)|の第 ーピークをカーブフィット法により解析した結果, Se 原子の隣にTe 原子が存在する確率がほぼTe 濃 度に比例していることがわかった。すなわち、Te と Se が鎖内でランダムに分布していると考えられ る。また、図6には、この解析により求められた Se-Se 結合長及び Se-Te 結合長の濃度依存性を、 モルデナイト中の Se-Te 混合系 (Se1-xTex -M(Na))と三方晶系混合系(t-Se_{1-x}Te_x)につい て示した。いずれの場合も、Se-Te結合長はSe-Se 結合長よりも 0.2 A 程度長い。 また, Se_{1-x} Te_x -M(Na)の Se-Se 及び Se-Te 結合長は t- $Se_{1-x}Te_x$ に比べて著しく収縮している。 これは 前述のように、鎖間相互作用を取り除いたこと による共有結合の強化のあらわれと考えられる。 興味深いことには、孤立カルコゲン混合鎖におい て、 Te 濃度の増加と共に、 Se-Se 結合長が伸長 しているのに対し、Se-Te 結合長は殆ど変化しな い。この原因として、 Te の LP 電子軌道がある程 度広がっているため、鎖内の隣接する Se の o* 軌道 と混成し、Se-Se結合が弱まることが考えられる。 図7にこの様子を模式的に示した。Te-Se 結合長 は、TeとSeをつなぐ結合軌道がTeのLP軌道と 直交しているため、殆ど影響を受けないと考えられ る。



Se-Se結合長(O・Se_{1-x}1e_x-M(Na),
 I-Se_{1-x}Te_x)及びSe-Te結合長
 (●:Se_{1-x}Te_x-M(Na), ■:t-Se_{1-x}
 Fe_x)の濃度依存性



図 7 カルコゲン混合鎖におけるTeのLP軌道
 と Seの o*軌道の混成

3. 孤立カルコゲン鎖の電子状態

前節では,隣接するカルコゲン原子のLP軌道と σ*軌道の混成が,カルコゲンの鎖状構造に影響を 与えることを指摘した。ここでは,モルデナイト細 孔中の一次元カルコゲン鎖の電子状態について,最 近の光学的性質の測定結果を踏まえて検討を加える。

図8は、Na型モルデナイト中のSe-Te混合鎖 (Se_{1-x}Te_x-M(Na))について、光音響分光法 (PAS)を用いて得られた、室温における光吸収 スペクトルである。PASは、通常の透過法では測 定しにくい粉末試料についても吸収スペクトルを得 ることができ、また、高感度であるため低吸収領域 までの測定が可能である。試料に光を照射すると、



 230 R (23) 5 3 5 Cl-x 1 Cx M (NA) の光音響分光スペクトル

 図中の数字はTe 濃度 x を表わす。 点線の交点から吸収端 Eg を見積る。

試料によって吸収された光エネルギーの一部が熱に 変換され、これにより試料周辺の気体が熱膨張する。 照射光として断続光を用いれば、周辺の気体が膨張 収縮をくりかえすことにより、音波が発生する。 この音波の強度変化から光吸収スペクトルを導出す るのがPASの原理である⁹⁾。Se-M(Na)では、光 吸収は2 eV 付近から急激に、ほぼ直線的に増大す る。2.7 eVより高エネルギー領域では、試料による 吸収が大きいため PAS 信号は飽和する。 Te を添 加していくと、スペクトルは低エネルギー側へほぼ 平行移動する。 PAS スペクトルから吸収係数の絶 対値を導出することは困難であるが、 PAS 信号の 飽和値に対応する吸収係数は、カルコゲン結晶のデ ータなどを援用して、10⁸ cm⁻¹より大きいと見積ら れる。ここでは、図8に点線で例示したように、 PAS スペクトルの直線部分を高エネルギー側へ外 挿し, 飽和値に達するエネルギーを吸収端 Egと考 える。Se_{1-x}Te_x-M(Na)のE_gの濃度依存性を図 9に示す。比較のため、 t-Se_{1-x} Te_xについても同 様の方法でEgを求めてプロットした。Se-M(Na) のEgが, t-Seに比べて1eV 近くも大きいことが わかる。これは、 Se 鎖を孤立化し、隣接鎖間の相 互作用を取り去ると、共有結合が強化されることを 示している。 Te を添加していくと、孤立カルコゲ ン鎖の E。は減少する。E。の減少は、Teの比較的 広がったLP軌道とSeの o* 軌道間の混成に起因す ると考えられる(図7参照)。これは、EXAFS実験 から得られた Se-Se 結合長が Te の添加により増



図9 290KにおけるSe_{1-x}Te_x-M(Na)と t-Se_{1-x}Te_xの*E*_gの濃度依存性

加するという図6の結果と符合する。結晶で, Egの 濃度変化がより大きいのは,隣接鎖間の相互作用の 寄与が付け加わったためである。

4. カルコゲン鎖に及ぼす交換性カチオンの効果 モルデナイト内壁に存在する交換性カチオンが細 孔中に導入されたカルコゲン鎖にどのような影響を 及ぼすか,について検討を加える。図10はRb型モ ルデナイト(M(Rb))にSeを吸蔵した試料(Se-M(Rb))について,RbのK吸収端近傍のEXAFS 振動 x(k)を示す。この x(k)は、酸素からの後方 散乱振幅(図5参照)が大きい kの小さい領域でのみ 振動が大きく,Se からの後方散乱振幅が大きい 8 Å⁻¹ 近傍では殆ど振動が見られない。すなわち、細 孔中の Se 鎖は内壁の Rb⁺ イオンと殆ど空間的な相 関をもたないことが結論される。



近傍でのEXAFS振動 X(k)

ところが、内壁の交換性カチオンを Co²⁺ などの 遷移金属イオンに交換すると、 Se を包接したモル デナイトはオレンジ色から黒色へと変化する。これ は、遷移金属の d 電子軌道が Se の p 電子軌道との 間に混成を起こすことによる²⁾。

EXAFS 測定は,内壁の Co イオン周辺の原子配 列,細孔中の Se の原子配列等の情報を引き出すた めの有力な手段である。図 11 に, Co のK吸収端近 傍の EXAFS 振動が, Se を吸蔵することによりど のように変化するかを示した。吸蔵前の Co 型モル



図11 M(Co)とSe-M(Co)及びこれを水素
 還元した試料(Se-M(Co) red.)についてのCoのK吸収端近傍でのEXAFS
 振動 x(k)

デナイト(M(Co))では,酸素からの後方散乱が強 く Co-O 相関が強いことを示している。ところが Seを吸蔵する(Se-M(Co))と、8Å⁻¹ 近傍に明 白な振動が出現し,Co-Se間の相関が現れる。動 径分布関数 |F(r)|をカーブフィット法により解析 すると、Co-O間距離は22Å,Co-Se間距離は 24Åであった。更に、Se-M(Co)を水素気流中 で還元した試料(Se-M(Co)red.)では、Co-O 相関は殆どなくなり、Co-Se 相関がより顕著にな る。水素還元により、内壁のCo²⁺イオンはH⁺イオ ンと交換し、細孔中にSeとCoの合金が形成され ると考えられる。この時、SeのK吸収端近傍の EXAFS振動も大きく変化する。

本研究は,乾 雅祝,片山芳則,丸山健二,星野 英興,田村剛三郎各氏の協力によって行なわれたも のである。

文 献

- 1) K. Tamura, S. Hosokawa, H. Endo, S. Yamasaki and H. Oyanagi, J. Phys. Soc. Japan, 55, 528 (1986).
- 2) 遠藤裕久, セラミックス, 22, 125 (1987).
- 3) 遠藤裕久,八尾 誠,表面,25,394 (1987).
- H. Endo, M. Inui, M. Yao, K. Tamura, H. Hoshino, Y. Katayama and K. Maruyama, Z. Phys. Chemie, Neue Folge, 156, 507 (1988).
- M. Inui, M. Yao and H. Endo, J. Phys. Soc. Jpn., 57, 553 (1988).
- O. Terasaki, K. Yamazaki, J. M. Thomas, T. Ohsuna, D. Watanabe, J. V. Sanders and J. C. Barry, *Nature*, 330, 58 (1987).
- 7) B. K. Teo, EXAFS: Basic Principles and Data Analysis (1986) Springer.
- B. K. Teo and P. A. Lee, Am. Chem. Soc., 101, 2815 (1979).
- 9) 沢田嗣郎,光音響分光法とその応用 PAS(1982)
 学会出版センター.